

Prof. Dr. EMRE COŞKUN

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 286 218 0018](tel:+902862180018) Dahili: 22220

E-posta: ecoskun@comu.edu.tr

Web: <https://avesis.comu.edu.tr/ecoskun>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0002-6820-3889

Yoksis Araştırmacı ID: 124266

Eğitim Bilgileri

2012 - 2014	Post Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik, Türkiye
2005 - 2012	Doktora, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, Türkiye
2003 - 2005	Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye
1996 - 2003	Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

2012	İnce filmlerin optik özelliklerinin integral dönüşüm yöntemleri ile incelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, Doktora
2005	TiGaSe ₂ kristalinin ısı uyarılmış akım yöntemi ile incelenmesi , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler , Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri, Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor	Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik
2005 - 2019	Araştırma Görevlisi Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik

Verdiği Dersler

2020 - 2021	Genel Fizik II, Lisans
2019 - 2020	Genel Fizik II, Lisans
2020 - 2021	Genel Fizik I, Lisans
2019 - 2020	Biyofizik, Lisans
2019 - 2020	Genel Fizik I, Lisans
2018 - 2019	Advance Quantum Mechanics, Yüksek Lisans

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **A new method to determine the continuous refractive index of an absorbing film by Generalized Stockwell Transform**
COŞKUN E., Emir C., Selamet S., PARLAK M., ÖZDER S.
Optics and Laser Technology, cilt.167, 2023 (SCI-Expanded)
- II. **Nanowire geometry effects on devices and transport mechanisms: SnS₂/SiNW heterojunction**
Coşkun E., Emir C., Terlemezoglu M., Parlak M.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, cilt.58, ss.15132-15143, 2023 (SCI-Expanded)
- III. **Improvement of electrical characteristics of SnSe/Si heterostructure by integration of Si nanowires**
Coşkun E., Gullu H. H., Emir C., Parlak M.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.604, 2021 (SCI-Expanded)
- IV. **Simultaneous determination of the thickness and refractive index dispersion of dielectric films by the Paul wavelet transform**
ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.
THIN SOLID FILMS, cilt.692, 2019 (SCI-Expanded)
- V. **FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF TiO₂ THIN FILM FOR DEVICE APPLICATIONS**
Hosseini A., Gullu H. H., Coskun E., Parlak M., Ercelebi C.
SURFACE REVIEW AND LETTERS, cilt.26, sa.6, 2019 (SCI-Expanded)
- VI. **Effects of Si nanowire on the device properties of n-ZnSe/p-Si heterostructure**
Coskun E., Gullu H. H., Colakoglu T., Emir C., Bozdogan E., Parlak M.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, sa.5, ss.4760-4765, 2019 (SCI-Expanded)
- VII. **The zero order generalized Morse wavelet method to determine the refractive index and extinction coefficient dispersions of an absorbing film**
KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., Tiryaki E., ÖZDER S.
THIN SOLID FILMS, cilt.673, ss.72-77, 2019 (SCI-Expanded)
- VIII. **Optical band gap and dispersion of optical constants of Cu-Ga-S thin films**
Isik M., Gullu H. H., Coskun E., HASANLI N.
OPTIK, cilt.186, ss.147-154, 2019 (SCI-Expanded)
- IX. **Determination of phase from the ridge of CWT using generalized Morse wavelet**
KOCAHAN YILMAZ Ö., Tiryaki E., COŞKUN E., ÖZDER S.
MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.29, sa.3, 2018 (SCI-Expanded)
- X. **The generalized Morse wavelet method to determine refractive index dispersion of dielectric films**
KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZCAN S., COŞKUN E., ÖZDER S.
MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, sa.4, 2017 (SCI-Expanded)
- XI. **Investigations of thermal annealing role on the optical properties of Zn-In-Se thin films**
Gullu H. H., COŞKUN E., Parlak M.
OPTIK, cilt.144, ss.603-612, 2017 (SCI-Expanded)
- XII. **Generalized Morse wavelet for the determination of the birefringence of a liquid crystal cell**
KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S.
MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.26, sa.8, 2015 (SCI-Expanded)
- XIII. **Device behavior of an In/p-Ag(Ga,In)Te-2/n-Si/Ag heterojunction diode**
COŞKUN E., Gullu H. H., CANDAN İ., Bayrakli O., PARLAK M., Ercelebi C.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.34, ss.138-145, 2015 (SCI-Expanded)
- XIV. **Study on the Structural and Electrical Properties of Sequentially Deposited Ag-Ga-In-Te Thin Films**
COŞKUN E., Gullu H. H., Parlak M., Ercelebi C.
JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS, cilt.178, ss.162-173, 2015 (SCI-Expanded)
- XV. **Investigation of structural and optical parameters of Cu-Ag-In-Se thin films deposited by thermal evaporation method**
Gullu H. H., CANDAN İ., COŞKUN E., Parlak M.
OPTIK, cilt.126, sa.18, ss.1578-1583, 2015 (SCI-Expanded)
- XVI. **Device application of AgGa_{0.5}In_{0.5}Se₂ thin films deposited by thermal sequential stacked layer**

method

COŞKUN E., GULLU H. H., PARLAK M.

MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.1, sa.4, 2014 (SCI-Expanded)

XVII. Characterization of Co-evaporated Cu-Ag-In-Se Thin Films

GULLU H. H., COŞKUN E., PARLAK M.

BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.44, sa.6, ss.719-725, 2014 (SCI-Expanded)

XVIII. Generalized Morse wavelets for the phase evaluation of projected fringe pattern

KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S.

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.25, sa.10, 2014 (SCI-Expanded)

XIX. The Paul wavelet algorithm: an alternative approach to calculate the refractive index dispersion of a dielectric film from transmittance spectrum

COŞKUN E., ÖZDER S., TIRYAKI E.

APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS, cilt.113, sa.2, ss.243-250, 2013 (SCI-Expanded)

XX. Structural and optical properties of Zn-In-Te thin films deposited by thermal evaporation technique

GULLU H. H., BAYRAKLI O., CANDAN İ., COŞKUN E., PARLAK M.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.566, ss.83-89, 2013 (SCI-Expanded)

XXI. Paul wavelet algorithm for the determination of birefringence dispersion of a liquid crystal cell

COŞKUN E., ÖZDER S.

JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, cilt.28, sa.12, ss.2974-2978, 2011 (SCI-Expanded)

XXII. Determination of the refractive index of a dielectric film continuously by the generalized S-transform

COŞKUN E., SEL K., ÖZDER S.

OPTICS LETTERS, cilt.35, sa.6, ss.841-843, 2010 (SCI-Expanded)

XXIII. Refractive index and extinction coefficient determination of an absorbing thin film by using the continuous wavelet transform method

COŞKUN E., SEL K., ÖZDER S., KURT M.

APPLIED OPTICS, cilt.47, sa.27, ss.4888-4894, 2008 (SCI-Expanded)

XXIV. Determination of birefringence dispersion in nematic liquid crystals by using an S-transform

OZDER S., COŞKUN E., KOYSAL O., KOCAHAN O.

OPTICS LETTERS, cilt.32, sa.14, ss.2001-2003, 2007 (SCI-Expanded)

XXV. Optical phase distribution evaluation by using an S-transform

OZDER S., KOCAHAN O., COŞKUN E., GOKTAS H.

OPTICS LETTERS, cilt.32, sa.6, ss.591-593, 2007 (SCI-Expanded)

XXVI. The effect of thermal annealing on impurity states in ferroelectric-semiconductor TlGaSe₂ within the incommensurate phase

SEYIDOV M., COŞKUN E., SAHİN Y., KHAMOEVEV R., SULEYMANOV R.

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.21, sa.2, ss.171-174, 2006 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. An improved method for determination of refractive index of absorbing films: A simulation study

ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.

AIP Conference Proceedings, cilt.1815, ss.500091-500094, 2017 (Hakemli Dergi)

II. An Improved Method For The Determination Of Birefringence Dispersion Of Liquid Crystal Cell: A Simulation Study

ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.

AIP Conference Proceedings , cilt.1722, sa.1, ss.900021-900024, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Numerical Approach for Determination of The Refractive Index of Dielectric Film from Reflectance Spectrum at Various Angles of Incidence by Using Paul Wavelet**
SELAMET S., TİRYAKİ E., Emir C., COŞKUN E.
Türk Fizik Derneği 39. Kongresi (2023), Muğla, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2023, ss.128
- II. **Surface Profile Determination by Generalized Morse Wavelet: A Simulation Study**
UYANIK M., SELAMET S., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E.
Türk Fizik Derneği 38. Kongresi (2022), Muğla, Türkiye, 31 Ağustos 2022
- III. **Determination of the theoretically created surface profile by Generalized S-Transform**
SELAMET S., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E.
Türk Fizik Derneği 38. Kongresi (2022), Muğla, Türkiye, 31 Ağustos 2022
- IV. **Cardiac tissue models to investigate the heart mechanobiology**
Zanetti M., Andolfi L., Guttner E. B., COŞKUN E., BEK A., Taylor M. R., Mestroni L., Lazzarino M.
Crossnano Workshop 2022, İtalya, 22 Şubat 2022
- V. **TEMPERATURE DEPENDENT CHARACTERIZATION OF SnS/Si NANOWIRE DEVICE APPLICATION**
COŞKUN E., GÜLLÜ H. H., EMİR C., PARLAK M.
Türk Fizik Derneği 36 sempozyum, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2020, ss.78
- VI. **Determination of surface profile of thin films by continuous wavelet transform.**
TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ÖZDER S.
6. International Conference of Material Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2019), Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019
- VII. **Electrical Properties of ZnSe/Si Nanowire and ZnSe/Si Heterostructures**
BOZDOĞAN E., COŞKUN E., ÖZDER S., GÜLLÜ H. H., PARLAK M.
Turkish Physical Society 34th International Physics Congress (TFD-34), Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018
- VIII. **n-ZnSe/p-Si Nanotel Heteroeklemlerin Foto-İletkenlik Davranışlarının İncelenmesi**
COŞKUN E., GÜLLÜ H. H., PARLAK M.
23. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 Aralık 2017
- IX. **Determination of the Interface Properties of p-CZTSe/n-Si Nanowire Heterojunction Diode**
BAYRAKLI Ö., TERLEMEZOĞLU M., GÜLLÜ H. H., YILDIZ D. E., ÇOLAKOĞLU T., COŞKUN E., PARLAK M.
Materials Research Society (MRS) 2017 Fall Meeting, Boston, 26 Kasım - 01 Aralık 2017
- X. **Optical properties of silicon nanowires for different length fabricated by metal assisted chemical etching method**
BOZDOĞAN E., COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö.
Turkish Physical Society 33th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2017
- XI. **Production of silicon nanowire having different size by using metal assisted chemical etching method**
BOZDOĞAN E., COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö.
Turkish Physical Society 33th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2017
- XII. **Synthesis and Structural Characterization on the (Cu,Ag)GaTe₂ Thin Films Deposited on Si Nanowires**
COŞKUN E., GÜLLÜ H. H., BAYRAKLI Ö., TERLEMEZOĞLU M., PARLAK M.
European Materials Research Society-Spring Meeting 2017, 22 - 26 Mayıs 2017
- XIII. **A Simulation Study for Determination of Refractive Index Dispersion of Dielectric Film from Reflectance Spectrum by Using Paul Wavelet**
Tiryaki E., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.
32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, cilt.1815
- XIV. **Optical Phase Distribution Evaluation by Using Zero Order Generalized Morse Wavelet**
KOCAHAN YILMAZ Ö., Elmas M. N., Durmus C., COŞKUN E., Tiryaki E., ÖZDER S.
32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, cilt.1815

- XV. **Quantitative Phase Imaging of Red Blood Cell by Diffraction Phase Microscopy**
KOCAHAN YILMAZ Ö., Tiryaki E., Durmus C., Elmas M. N., COŞKUN E., ÖZDER S.
International Workshop on Computing and Electromagnetics (CEM), Barcelona, İspanya, 21 - 24 Haziran 2017, ss.21-22
- XVI. **An Improved Method For Determination Of Refractive Index Of Absorbing Films: A Simulation Study**
Özcan S., Coşkun E., Kocahan Yılmaz Ö., Özder S.
32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, cilt.1815
- XVII. **3D Profile Measurements of Objects by Using Zero Order Generalized Morse Wavelet**
KOCAHAN YILMAZ Ö., Durmus C., Elmas M. N., COŞKUN E., Tiryaki E., ÖZDER S.
32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, cilt.1815
- XVIII. **An Improved Method For Simultaneous Determination Of Refractive Index And Thickness Of Dielectric Films A Simulation Study**
ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.
Science and Applications of Thin Films, Congress & Exhibition - SATF 2016, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2016
- XIX. **Design and Device Application of Si Based Cu Ag Ga Te Thin Film Heterojunction**
GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., BAYRAKLI Ö., PARLAK M.
Science and Application of Thin Films, Conference and Exhibition, 19 - 23 Eylül 2016
- XX. **Determination of the Refractive Index of Dielectric Films from the Transmittance Spectrum by Using Morse Wavelet**
TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., ELMAS M. N., ÖZDER S.
Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition SATF 2016, 19 - 23 Eylül 2016
- XXI. **Theoretical Determination of the Refractive Index and Extinction Coefficient of an Absorbing Thin Film by Using Morse Wavelet**
TİRYAKİ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., COŞKUN E., DURMUŞ Ç., ÖZDER S.
Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF 2016), 19 - 23 Eylül 2016
- XXII. **3D profile measurements of objects by using zero order generalized Morse wavelet**
KOCAHAN YILMAZ Ö., DURMUŞ Ç., ELMAS M. N., COŞKUN E., TİRYAKİ E., ÖZDER S.
Turkish Physical Society 32th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2016
- XXIII. **A simulation study for determination of refractive index dispersion of dielectric film from reflectance spectrum by using Paul wavelet**
TİRYAKİ E., COŞKUN E., ÖZDER S., BOZDOĞAN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ELMAS M. N.
Turkish Physical Society 32th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2016
- XXIV. **Determination of the refractive index dispersion of dielectric film from reflectance spectrum by using Morlet wavelet**
TİRYAKİ E., COŞKUN E., ÖZDER S., KUŞ E., KOCAHAN YILMAZ Ö., DURMUŞ Ç.
Turkish Physical Society 32th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2016
- XXV. **An improved method for determination of refractive index of absorbing films a simulation study**
ÖZCAN S., COŞKUN E., ÖZDER S., KOCAHAN YILMAZ Ö.
Turkish Physical Society 32th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2016
- XXVI. **Optical phase distribution evaluation by using zero order generalized Morse wavelet**
KOCAHAN YILMAZ Ö., ELMAS M. N., DURMUŞ Ç., COŞKUN E., TİRYAKİ E., ÖZDER S.
Turkish Physical Society 32th International Physics Congress, 6 - 09 Eylül 2016
- XXVII. **Fabrication and Characterization of p CuInSe₂ n Si Heterojunction Diodes**
GÜLLÜ H. H., BAYRAKLI Ö., COŞKUN E., PARLAK M.
32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 20 - 24 Haziran 2016
- XXVIII. **Characterization of CZTSe Thin Films for Solar Cell**
BAYRAKLI Ö., GÜLLÜ H. H., TERLEMEZOĞLU M., PARLAK M., COŞKUN E.
32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 20 - 24 Haziran 2016
- XXIX. **Effect of Nanowire Length on Device Performance of n ZnSe p Si Nanowire Heterojunctions**

COŞKUN E., GÜLLÜ H. H., ÇOLAKOĞLU T., BAYRAKLI Ö., PARLAK M.

32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 20 - 24 Haziran 2016

XXX. Device characterization of Zn Sn Se ZTSe thin films for solar cell

BAYRAKLI Ö., GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., PARLAK M.

European Materials Research Society 2016, 2 - 06 Mayıs 2016

XXXI. Effect of nanowire length on device performance of n In₂Se₃ p Si heterojunctions

COŞKUN E., ÇOLAKOĞLU T., GÜLLÜ H. H., BAYRAKLI Ö., PARLAK M.

European Materials Research Society 2016, 2 - 06 Mayıs 2016

XXXII. Studies on Device Properties of n ZnSe p Si Heterojunction Diode

GÜLLÜ H. H., BAYRAKLI Ö., COŞKUN E., PARLAK M.

European Materials Research Society 2016, 2 - 06 Mayıs 2016

XXXIII. Optical Behaviour of Sequential Thermal Evaporation ZnInSe₂ Thin Films

GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., BAYRAKLI Ö., PARLAK M.

European Materials Research Society 2016, 2 - 06 Mayıs 2016

XXXIV. Device characterization of Cu Ag Ga Te thin films for photovoltaic applications

COŞKUN E., GÜLLÜ H. H., PARLAK M.

Materials Research Society 2016, 28 Mart - 01 Nisan 2016

XXXV. An Improved Method For The Determination Of Birefringence Dispersion Of Liquid Crystal Cell: A Simulation Study

ÖZCAN S., COŞKUN E., KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZDER S.

9th International Physics Conference of the Balkan-Physical-Union (BPU), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015, cilt.1722

XXXVI. Investigation of Electrical Properties of Cu Ag In Se Thin Films Deposited by Thermally Evaporation Method

GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., BAYRAKLI Ö., PARLAK M., ERÇELEBİ A. Ç.

EU PVSEC 2015 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 14 - 18 Eylül 2015

XXXVII. Fabrication and Characterization of p AgGaIn_{1-x}Te₂ n ZnInSe₂ Heterojunctions for Solar Cell Applications

BAYRAKLI Ö., GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., PARLAK M.

2015 MRS Spring Meeting & Exhibit, 6 - 10 Nisan 2015

XXXVIII. Material and Device Characterization of Cu_{0.5}Ag_{0.5}InSe₂ and ZnInSe₂ Thin Films for Photovoltaic Applications

GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., BAYRAKLI Ö., PARLAK M.

2015 MRS Spring Meeting & Exhibit, 6 - 10 Nisan 2015

XXXIX. Investigation of optical parameters of thermally evaporated ZnSe thin films

Güllü H. H., COŞKUN E., Parlak M.

3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition (SolarTR), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2015, cilt.12, ss.1224-1228

XL. Characterization of Sputtered Cu Zn Sn Te Thin Films for Device Applications

Hosseini A., GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., TURAN R., ERÇELEBİ A. Ç.

E-MRS 2014, 03 Haziran 2014

XLI. Fabrication and Characterization of TiO₂Thin Films for Device Applications

HOSSEINI A., GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., TURAN R., ERÇELEBİ A. Ç.

E-MRS 2014, 20 - 22 Nisan 2014

XLII. PLAZMA DESTEKLİ KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME SİSTEMİ İLE BÜYÜTÜLEN HİDROJENLENMİŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR İNCE FİMLERE RADYO FREKANSI GÜCÜ ETKİSİNİN X ISINI FOTOELEKTRON SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ

GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., PARLAK M.

MYOMAT 2009: İLULUSAL METAL, YARIİLETKEN veOKSİT MATERYALLERİN ÜRETİMİNDEKİ KULLANILAN SİSTEMLER ve ANALİZ TEKNİKLERİ KONGRESİ, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008

XLIII. Profile Measurement of Objects by Using Stockwell and Continuous Wavelet Transforms

Kocahan O., COŞKUN E., ÖZDER S.

IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications Conference, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008, ss.804-807

XLIV. S-transform analysis of projected fringe patterns - art. no. 66161A

Kocahan O., ÖZDER S., COŞKUN E.

Conference on Optical Measurement Systems for Industrial Inspection V, Munich, Almanya, 18 - 22 Haziran 2007, cilt.6616

XLV. Optical phase distribution evaluation by using S-transform

Kocallan O., ÖZDER S., COŞKUN E.

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.684

XLVI. The determination of birefringence dispersion in nematic liquid crystals by using the S-transform

COŞKUN E., Oezder S., Kocahan O., Koeysal O.

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.439-440

Desteklenen Projeler

2021 - 2023	İnce filmlerin 3D yüzey profillerinin belirlenmesi için yüzey profili ölçüm algoritması geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi
2019 - 2020	Metal destekli kimyasal aşındırma yöntemi ile farklı boyutlarda veveya açılarda Silisyum nano ipliksi yapıların üretimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2018 - 2020	SiC ve Metal Oksit Filmler Kullanılarak Yeni Nesil Kristal Si Heteroeklem (SHJ) Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi (SiMOX), TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi
2018 - 2019	Beyaz ışık faz mikroskopisi ile ince filmlerin yüzeylerinin görüntülenmesi ve faz dağılımlarının genelleştirilmiş stockwell dönüşümü kullanılarak hesaplanması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2018	Mikrometre Boyutlu Cisimlerin ÜçBoyutlu Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Genelleştirilmiş Morse Dalgacı Faz Hesaplama Yöntemi, TÜBİTAK Projesi
2010 - 2012	İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin İntegral Dönüşüm Yöntemleri İle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2010	Optics Letters, SCI Kapsamındaki Dergi
-----------	--

Metrikler

Yayın: 75

Atıf (WoS): 166

Atıf (Scopus): 177

H-İndeks (WoS): 7

H-İndeks (Scopus): 7

Burslar

2012 - 2014	2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK
-------------	---